

**ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМ
GaAs/Al_xGa_{1-x}As В СТРУКТУРАХ
ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ**

Б. Р. Варданян, Р. Р. Резванов, М. В. Чукичев, А. Э. Юнович

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119899, Москва, Россия
(Получена 18 мая 1993 г. Принята к печати 24 августа 1993 г.)

В спектрах фото- и катодoluminesценции множественных квантовых ям GaAs/Al_xGa_{1-x}As ($x = 0.30 \div 0.35$), выращенных МОС гидридной эпитаксией и предназначенных для ИК фотоприемников, наблюдаются дополнительные линии и уширение спектральных полос. Показано, что эти изменения в спектрах люминесценции могут быть объяснены прежде всего флуктуациями ширины квантовых ям. На спектры влияют и примесные состояния доноров. Обсуждается влияние факторов, проявляющихся в спектрах люминесценции, на спектры ИК поглощения.

1. Введение

В работах [1, 2] было показано, что многослойные гетероструктуры с множественными квантовыми ямами (МКЯ) на основе GaAs/Al_xGa_{1-x}As, изготовленные методом МОС гидридной эпитаксии, могут быть использованы для создания ИК фотоприемников в диапазоне длин волн 8÷10 мкм. В [2] цитировались две работы [3, 4], в которых также показывалась эта возможность, и даны ссылки на предшествовавшие работы. Однако в [3, 4] не сообщалось о люминесцентном анализе структур. Из совместного анализа спектров катодoluminesценции (КЛ) и фотопроводимости (ФП) в [1, 2] следовало, что возможно объяснить наблюдаемые спектры простой моделью прямоугольных потенциальных ям. Согласовать данные разных опытов оказалось возможным, учитывая роль доноров, которыми легированы квантовые ямы.

В настоящей работе проведено исследование спектров КЛ и фотoluminesценции (ФЛ) структур с легированными МКЯ при изменении глубины потенциальных ям в пределах $V_{oe} = 0.24 \div 0.29$ эВ вариацией состава Al_x·Ga_{1-x}As ($x = 0.30 \div 0.35$). Спектры проанализированы с учетом флуктуаций ширины и глубины МКЯ и влияния легирования. Обсуждается возможное влияние этих факторов на ИК фотопроводимость.

2. Исследованные образцы и методика эксперимента

Структуры с МКЯ на основе гетеропереходов GaAs/Al_xGa_{1-x}As были изготовлены в АО «Сигма Плюс» [1, 2] методом газовой эпитаксии из металлоорганических соединений (МОС гидридной эпитаксии) при температуре 700 °C и давлении в реакторе 65 мм рт. ст. На n⁺-подложке из GaAs ($n = 2 \cdot 10^{18}$ см⁻³) выращивалось от 64 до 70 периодов сверхрешетки — МКЯ с шириной ям $L_z = 3 \div 6$ нм (GaAs) и шириной барьера $L_B = 23 \div 50$ нм (Al_xGa_{1-x}As). Ямы легировались Si до $(5 \div 10) \cdot 10^{17}$ см⁻³; барьеры нелегированы, с остаточной концентрацией $N_{D2} = (0.8 \div 2) \cdot 10^{16}$ см⁻³. Верхний контактный

Параметры образцов МКЯ GaAs/Al_xGa_{1-x}As и характерные положения максимумов в спектрах КЛ при T = 4.5 K

№ об-разца	x	L ₂ , Å	E _{g2} , эВ		$\Delta(\hbar\omega)_{1/2}$, мэВ	ΔE_D , эВ	L_2 , Å (эксперимент)	L_2 , Å (расчет)	V_{DE} эВ	
			Эксперимент	теория						
1	0.3	30	1.885	1.924	1.660	13	0.039	0.142	34	0.151
2	0.3	41	1.883	1.924	1.662	21	0.041	0.144	34.9	0.151
3	0.3	60	1.900	1.924	1.638	22	0.024	0.120	39.5	0.129
4	0.35	30	1.952	1.998	1.588	34	0.46	0.070	60.4	0.078
5	0.35	30	1.953	1.998	1.581	34	0.46	0.163	62.8	0.065
					1.682		0.164	0.186	34	0.163
					1.695	39	0.045	0.177	32	0.174
								0.186	30	0.186

Примечание. * По формуле (1). ** По формуле (5). *** По формуле (5) при $L_2 = L'_2$.

слой (0.6÷3 мкм) легировался до $N_D = (2 \div 3) \cdot 10^{18}$ см⁻³. Концентрации n и мольная доля Al_x в барьерах были измерены на профилометре «Polaron-200». Были исследованы две серии образцов (см. таблицу).

Для исследований КЛ была использована электронная пушка с энергией электронов 15÷50 кэВ и средним током в пучке 0.005÷0.15 мА. Излучение от образцов в металлическом криостате выводилось через кварцевое окно и направлялось на входную щель спектрометра ДФС-12 с фотоумножителем ФЭУ-83 на выходе. Для исследований ФЛ при T = 80 K применялся автоматизированный спектральный комплекс КСВУ-12; возбуждение осуществлялось Не—Не-лазером с длиной волны 0.63 мкм и плотностью мощности возбуждения ≈300 мВт/см².

3. Экспериментальные результаты

3.1. В спектрах КЛ при 4.5 K, как и в [1, 2], наблюдались линии и полосы в трех частях спектра с основным максимумом в области энергий $\hbar\omega_{1m} = 1.58 \div 1.70$ эВ, дополнительными слабыми максимумами в коротковолновой части и широкими полосами в длинноволновой части спектра (рис. 1—3; см. таблицу).

В первой серии для образца 1 при T = 4.5 K в спектрах КЛ наблюдался один основной максимум $\hbar\omega_{1m} = 1.660 \pm 0.001$ эВ; для образца 2 — двойная линия, один из максимумов совпадает с 1, а другоймещен в длинноволновую область, $\hbar\omega_{1m} = 1.638 \pm 0.004$ эВ. Ширина полосы на половине интенсивности для 1 равна $\Delta(\hbar\omega)_{1/2} = 12 \div 13$ мэВ; для 2 — ≈21 мэВ и 12÷13 мэВ соответственно для двух компонент. При возбуждении различных точек поверхности образца положение максимумов менялось в пределах ±0.003 эВ.

В спектрах ФЛ при T = 80 K для этих образцов наблюдалась только одна полоса — для 1 $\hbar\omega_{1m} = 1.656 \pm 0.004$ эВ, для 2 $\hbar\omega_{1m} = 1.626 \pm 0.004$ эВ; ширина полос ≈17 мэВ.

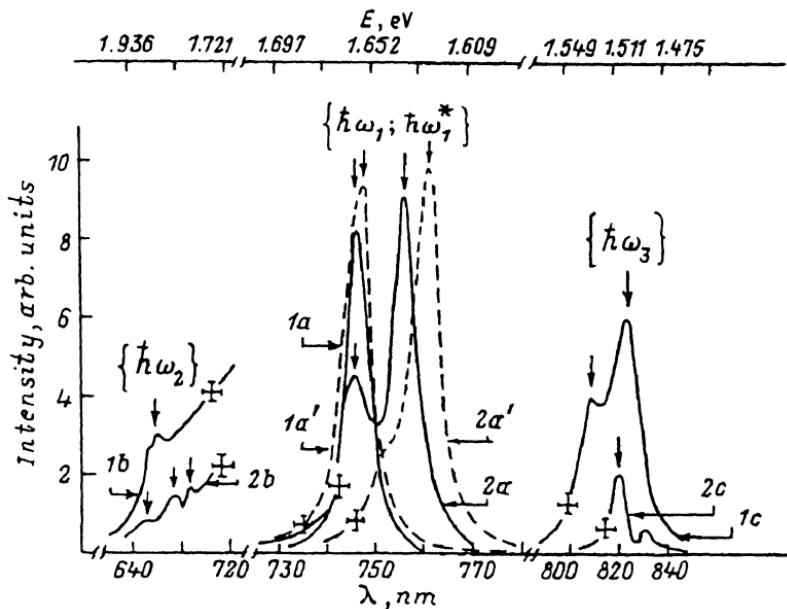


Рис. 1. Спектры люминесценции образцов первой серии; сплошные линии соответствуют катодолюминесценции при $T = 4.5$ К для образцов 1 (1a, 1b, 1c); 2 (2a, 2b, 2c). Штриховые линии — спектры фотолюминесценции при $T = 80$ К для образцов 1 (1a), 2 (2a). а, б, с — разные части спектров.

В спектрах КЛ в области высоких энергий наблюдались слабые максимумы при $h\omega_{2m} = 1.883 \div 1.885$ мэВ с интенсивностью в $5 \div 7 \cdot 10^3$ раз меньшей основного максимума. Для 2 наблюдалась структура вблизи 1.836 и 1.809 эВ (рис. 1). Эти пики связаны с излучательными переходами в барьерах. В области низких энергий для обоих образцов наблюдались широкие полосы с максимумами $h\omega_{3m} = 1.509 \div 1.530$ эВ с шириной ≈ 0.07 эВ. Эти полосы, как показали исследования в растровом электронном микроскопе [5], обусловлены люминесценцией контактного слоя и подложки.

При изменении T от 4.5 до 90 К (рис. 2) полоса КЛ сдвигалась в область низких энергий на $6 \div 12$ мэВ. Для образца 2, с двойной линией, с увеличением T при данном уровне возбуждения уменьшалась интенсивность компоненты с более низкой энергией. Интенсивность пика КЛ с энергией $h\omega_{1m} = 1.626$ эВ сравнительно велика. Отсюда понятно, почему при уровне возбуждения, меньшем на 2 порядка, в спектрах ФЛ при 80 К наблюдается только длинноволновая компонента.

3.2. Для образцов 3—5 второй серии спектры также имели три участка — основной, коротковолновый и длинноволновый. Основной максимум был шире, $\Delta(h\omega)_{1/2} = 0.034 \div 0.039$ эВ. В образце 3 можно было заметить раздвоение максимума (рис. 3, см. таблицу). Различие в положении коротковолнового максимума коррелировало с изменением состава твердого раствора в барьерах от $x = 0.30$ до $x = 0.35$ (см. таблицу).

Спектры ФЛ при $T = 80$ К имели вид полос с шириной $\Delta(h\omega)_{1/2} = 38 \div 44$ мэВ; они были сдвинуты относительно низкотемпературных спектров на $5 \div 12$ мэВ в сторону низких энергий.

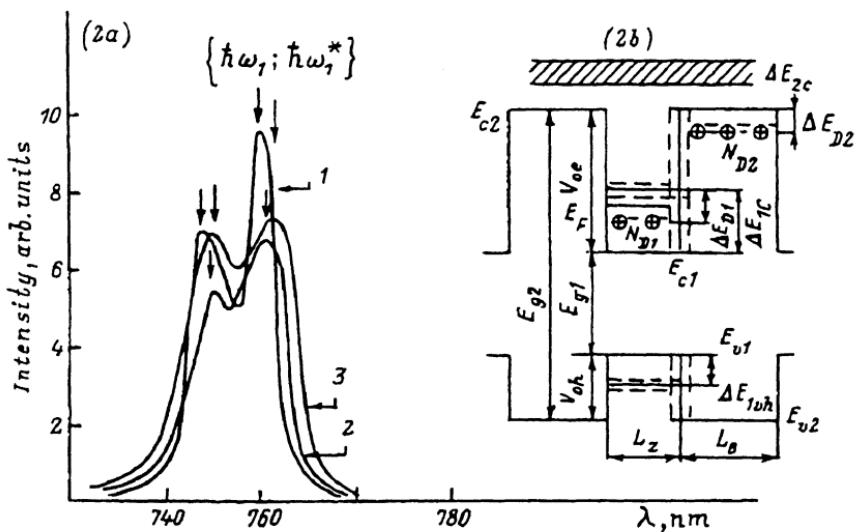


Рис. 2. Зависимость спектров катодолюминесценции от температуры при T , К: 1 – 5, 2 – 52, 3 – 86 для образца 2 (2a). На вставке: 2b – энергетическая диаграмма.

4. Обсуждение результатов

4.1. Рассмотрим возможные механизмы, влияющие на положение линий в спектрах люминесценции образцов. Положение основной линии должно зависеть от величины барьера на гетерограницах и от ширины потенциальных ям (рис. 2, b). На положение линий может влиять и легирование ям донорами. Диаграмма на рис. 2, b соответствует модели прямоугольных ям с идеальными гетерограницами. Линия $h\omega_{1m}$ соответствует переходам из уровней размерного квантования в зоне проводимости ΔE_{1c} на уровни тяжелых дырок ΔE_{1vb} ; на переходы могут также влиять уровни или хвосты плотности состояний, отщепленные от ΔE_{1c} . В такой модели

$$h\omega_{1m} = E_{g1} + \Delta E_{1c} + \Delta E_{1vb} \quad (1)$$

или, с учетом доноров,

$$h\omega_{1m} = E_{g1} + \Delta E_{1c} + \Delta E_{1vb} + \Delta E_{D1}, \quad (2)$$

где ΔE_{D1} – сдвиг, обусловленный легированием ям.

Выращивание структур проводилось так, чтобы их можно было использовать для ИК фотоприемников в области длин волн $8 \div 12$ мкм с фоточувствительностью, обусловленной переходами из основного уровня ΔE_{1c} в континуум [1, 2]. Поэтому L_z мало, и в яме должен быть лишь один уровень размерного квантования; второй уровень, размытый в мини-зону, является резонансным и сливаются с континуумом выше потенциального барьера V_{oe} .

Положение слабой высоконаправленной линии должно зависеть от состава твердого раствора, т. е. от V_{oe} . Величина V_{oe} в [1] была рассчитана в предположении, что максимум $h\omega_{2m}$ определяется значением E_{g2} и энергией ионизации доноров в барьере ΔE_{D2} , рассчитанной по водородоподобной модели, $\Delta E_{D2} = 10$ мэВ:

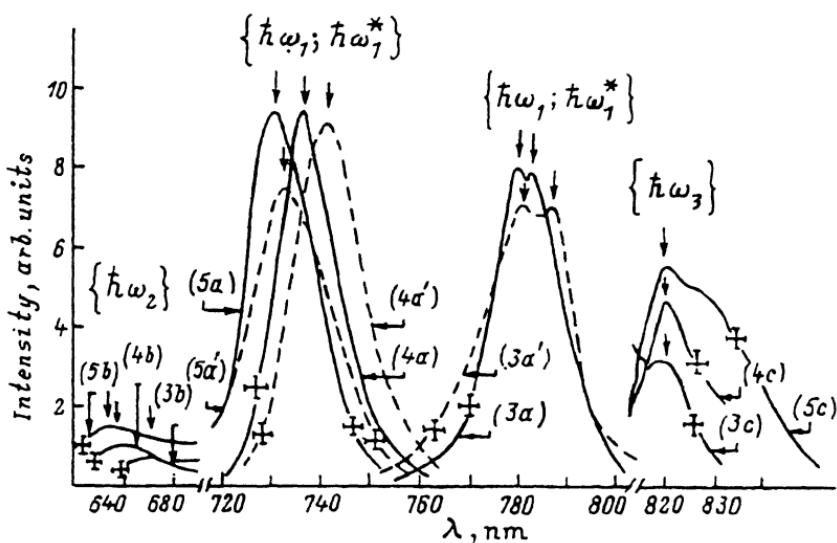


Рис. 3. Спектры люминесценции образцов второй серии; сплошные линии — катодолюминесценции при $T = 4.5$ К для образцов 3 (3 a , 3 b , 3 c), 4 (4 a , 4 b , 4 c), 5 (5 a , 5 b , 5 c). Штриховые линии — фотолюминесценция при $T = 80$ К для образцов 3 (3 a), 4 (4 a), 5 (5 a). a, b, c — разные части спектров.

$$\hbar\omega_{2m} = E_{g2} - \Delta E_{D2}. \quad (3)$$

Экспериментальные данные [6] дают значения $\Delta E_{D2} = 20 \div 80$ мэВ. В отличие от [1, 2] примем за исходный параметр состава x и рассчитаем E_{g2} по формулам из [7] квадратичной интерполяцией [E_{g1} (GaAs) = 1.518 эВ и $E_{g2,\Gamma}$ (AlAs) = 3.13 эВ при $T = 4.5$ К]:

$$E_{g2}(x, T = 4.5 \text{ K}) = 1.518 + 1.612x - 0.37x(1-x) \quad (\text{эВ}). \quad (4)$$

Тогда из экспериментальных значений $\hbar\omega_{2m}$ и формулы (3) следует, что $\Delta E_{D2} = 0.025 \div 0.045$ эВ (см. таблицу); это согласуется с [6]. В таблице приведены рассчитанные по формуле (4) значения $V_{oc} = \Delta E_{1c} = (0.60 \pm 0.02) \Delta E_g$ в соответствии с [8].

Уровни ΔE_{1c} и $\Delta E_{1v,h}$ рассчитывались по известным формулам:

$$\cos(k_1 L_z) + K \cdot \sin(k_1 L_z) = 0,$$

$$k_1 = (2m_1^* E)^{1/2}/\hbar; \quad k = (1/2) \left\{ \left[\frac{m_1^*(V_0 - E)}{m_2^* E} \right]^{1/2} - \left[\frac{m_2^* E}{m_1^*(V_0 - E)} \right]^{1/2} \right\} \quad (5)$$

(см. [1, 2] и ссылки там же; эффективные массы известны).

В таблице результаты расчетов $(\Delta E_{1c} + \Delta E_{1v,h})^{**}$ [по формуле (4) была рассчитана величина V_{oc}] сопоставлены с результатами расчетов по формуле (1) в предположении, что для $(\Delta E_{1c} + \Delta E_{1v,h})^*$ величина L_z соответствует заданным технологически. Различие 7 \div 27 мэВ больше погрешностей расчетов и экспериментов и требует объяснения.

Если вариации состава $\delta x \leq \pm 0.01$, то их влияние на ширину линии мало, $\Delta(\hbar\omega)_{1/2} \leq \pm 4$ мэВ. Если же вариации ширины ямы δL_z порядка одного атомного слоя на обеих гетерограницах $\delta L_z = \pm a_0/2$ ($a_0 = 5.66$ Å), то при величине $L_z = 40$ Å ширина спектральных линий соответствует $\Delta(\hbar\omega)_{1/2} \approx 20 \div 25$ мэВ.

Флуктуации ширины ям могут иметь характер случайных островков с размерами меньше боровского радиуса или террас с размерами больше боровского радиуса [9]. В первом случае флуктуации обусловливают уширение, а во втором — дублетное или триплетное расщепление линий в спектрах исследованных образцов. В таблице приведены значения ширины ям L'_z , которые отличаются от заданных L_z . Расчет $\hbar\omega_{1w}$ при таких L'_z дается в таблице значениями $(\Delta E_{1c} + \Delta E_{1vB})$.*** Они отличаются от рассчитанных по формуле (2) не более чем на 10 мэВ. Это различие можно объяснить влиянием доноров в ямах, если считать, что $\Delta E_{D1} \approx 10$ мэВ. В [9] влияние доноров не рассматривалось, поскольку МКЯ были нелегированы. Для образцов 1, 2 величина ΔE_{D1} того же порядка, что и ширина линий; для образцов 3—5 ΔE_{D1} заметно меньше $\Delta(\hbar\omega)_{1/2}$, и для них влияние доноров проявляется в уширении длинноволновой части линии. Для 1 с шириной ямы $L'_z = 7a_0$ (33.9 Å) экспериментальное значение $\Delta(\hbar\omega)_{1/2} = 13$ мэВ можно объяснить малыми размерами островков, гетерограница имеет флуктуации $\pm a_0/2$. Для образца 2 дублет можно связать с различием в ширинах ям порядка постоянной решетки a_0 : $L'_z = 6a_0$ и $7a_0$ (33.9 и 39.55 Å) и террасами, большими боровского радиуса. Для образца 3 дублетное расщепление, обусловленное крупномасштабными флуктуациями типа террас, сравнительно мало из-за большой ширины ям $L'_z = 60$ и 62.8 Å ($\Delta L'_z = a_0/2$). Для образцов 4, 5 островковые неоднородности на гетерограницах преобладают над неоднородностями типа террас; необходимо предположить, что $\Delta L'_z = \pm 2$ ($a_0/2$). Дублетное расщепление не наблюдается, а ширина линий $\Delta(\hbar\omega)_{1/2}$ велика.

Рассмотренная модель качественно объясняет как температурную зависимость структуры спектров, так и их отличие в ФЛ и КЛ. При низких T и малых уровнях возбуждения уровни с меньшей энергией в более широких ямах заполнены электронами с большей вероятностью; с увеличением T и плотности возбуждения уровни заполняются с большей энергией в более узких ямах.

4.2. Флуктуации ширины ям должны влиять на спектры поглощения и фотопроводимости, соответствующие переходам из основных уровней во вторую мини-зону. Если эти переходы соответствуют $\hbar\omega_m = 0.12$ эВ, то уширение линий $\Delta(\hbar\omega)_{1/2} = 30 \div 40$ мэВ составит около трети $\hbar\omega_m$ и должна существенно уменьшаться фоточувствительность в максимуме. Будет существенно и уширение второй мини-зоны, резонансной с континуумом. По данным [10, 11], эта зона имеет ширину $30 \div 80$ мэВ, что больше экспериментальных значений ширины спектров оптического поглощения [11]. Ширину второй мини-зоны можно рассчитать по формулам

$$-1 < \cos(k_1 L_z) \cos(k_2 L_B) + k \cdot \sin(k_1 L_z) \sin(k_2 L_B) < +1,$$

$$k_1 = (2m_1^* E)^{1/2}/h; \quad k_2 = [2m_2^*(E - V_{oc})]^{1/2}/h,$$

$$k = (1/2) \left\{ \left[\frac{m_1^*(E - V_{oc})}{m_2^* E} \right]^{1/2} + \left[\frac{m_2^* E}{m_1^*(E - V_{oc})} \right]^{1/2} \right\}. \quad (6)$$

Из расчетов для наших образцов следует, что флуктуации ширины ям порядка 2÷3 атомных слоев должны приводить к изменению ширины мини-зон от 7

до 20 мэВ. Соответственно должны ухудшаться и фотоэлектрические параметры, как это и наблюдалось для фотоприемников, изготовленных из структур второй серии. Таким образом, наблюдаемые особенности в спектрах КЛ и ФЛ могут служить для предсказания свойств ИК фотоприемников на основе МКЯ.

5. Выводы

1. Структуры с МКЯ на основе гетеропереходов $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, выраженные методом МОС гидридной эпитаксии и легированные в ямах Si, обнаруживаются в спектрах КЛ при 4.5 К линии и полосы, обусловленные переходами между уровнями размерного квантования в ямах, между уровнями доноров и валентной зоной в барьерах, межзонные переходы в контактном слое и подложке. В спектрах КЛ и ФЛ при 80 К наблюдаются лишь полосы, обусловленные переходами в ямах, контактном слое и подложке.

2. Основные линии, обусловленные переходами между уровнями размерного квантования электронов и тяжелых дырок, имеют энергию в максимуме 1.58 ± 1.70 мэВ. Наиболее чувствительным параметром при согласовании расчетов в модели прямоугольных потенциальных ям с экспериментом является ширина ям. Наблюдаемые дублетные расщепления и уширение основных линий можно объяснить изменениями ширины ям и их флуктуациями в пределах $1 \div 3$ атомных слоев. Необходимо учитывать сдвиги в спектрах, обусловленные влиянием уровней или хвостов плотности состояний доноров порядка 10 мэВ. Зависимость спектров КЛ и ФЛ от T в интервале 4.5–80 К и от интенсивности возбуждения можно объяснить изменениями заполнения уровней в ямах различной ширины.

3. Уширение спектральных полос люминесценции показывает, что флуктуации ширины ям могут существенно увеличивать ширину спектров и, следовательно, уменьшать фоточувствительность, обусловленную переходами из первых уровней размерного квантования в континуум.

Авторы выражают глубокую благодарность В. А. Горбылеву, И. Д. Залевскому, А. И. Петрову за предоставление выращенных ими образцов и обсуждение результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] V. A. Gorbylev, I. D. Zalevsky, V. B. Kulikov, A. I. Petrov, M. V. Chukichev, A. E. Yunovich. Abstracts Int. Conf. on Narrow Gap Semicond., 145. Southampton (July 1992).
- [2] В. А. Горбылев, И. Д. Залевский, А. И. Петров, А. А. Чельный, Г. Х. Аветисян, В. Б. Куликов, М. В. Чукичев, А. Э. Юнович. ФТП, 9, 1453 (1993).
- [3] J. Y. Andersson, L. Lundquist, Z. F. Paska. Appl. Phys. Lett., 58, 2264 (1991).
- [4] B. F. Levine, C. G. Bethea, G. Hasnain, O. V. Shen, E. Pelve, S. J. Hsieh. Appl. Phys. Lett., 56, 851 (1990).
- [5] Б. Р. Варданян, А. Р. Гареева, В. И. Петров, А. Р. Сафина, А. Э. Юнович (в печати).
- [6] P. K. Bhattacharya, U. Das, M. J. Ludowise. Phys. Rev. B, 29, 6623 (1984).
- [7] Landolt-Bornstein. Intrinsic Properties of Group IV Elements and III–V; II–VI and I–VII Compounds, 22, subvol. a, 136 (1987).
- [8] W. I. Wang, E. E. Mendes, F. Stern. Appl. Phys. Lett., 45, 639 (1984).
- [9] M. A. Herman, D. Bimberg, J. Christen. J. Appl. Phys., 70, R1 (1991).
- [10] E. Rosencher, E. Martinet, F. Luc, Ph. Bois, E. Bockenhoff. Appl. Phys. Lett., 59, 3255 (1991).
- [11] R. Sizmann, P. Helgesen, S. Lovold. Abstracts Int. Conf. on Narrow Gap Semicond., 72. Southampton (July 1992)..

Редактор В. В. Чалдышев.